

Elektronmikroskoopide kasutamine teadustöös Tallinna Polütehnilises Instituudis

Paat, Aadu Tehnikauuringute areng Eesti NSV-s : vabariikliku konverentsi ettekannete teesid Tallinn, 15.-16. oktoober 1986 1986 / lk. 179-181 https://www.ester.ee/record=b1258828*est

Method of sample preparation for electron-microscopic measurements

Nikittšenko, Ludmilla Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1992 / lk. 61-65: ill

Metitud rõngasketruslõngade uurimine skaneeriva elektronmikroskoobi abil

Roode, Sille; Viikna, Anti; Paat, Aadu XXV Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 25th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference 1999 / lk. 154

Влияние облучения низкоэнергетическими электронами в растровом электронном микроскопе на параметры полупроводниковых приборов

Meiler, Boriss; Kropman, Daniel; Levštēnkova, Alla Микроэлектроника 1987 / с. 165-169 : илл
https://www.ester.ee/record=b2147720*est

Изменение параметров интегральных схем при анализе в растровом электронном микроскопе

Meiler, Boriss Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 85-92
https://www.ester.ee/record=b1296001*est

Применение в ТПИ растворного электронного микроскопа в материаловедении

Paat, Aadu Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 79-84

Применение электронных микроскопов в научных исследованиях в Таллинском политехническом институте

Paat, Aadu Развитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы республиканской конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г. 1986 / с. 193-196 https://www.ester.ee/record=b1231513*est